

共通機器一覧 List of I2CNER shared equipment

from 2018.12

	Location	Resercher in charge	Equipment	Manufacturer/Type	Category	購入年度			
I2CNER Shared Equipment	1 I-201	貞清助教 / Dr. Harrington	Dr. Sadakiyo	全自動X線回折システム	Automatic X-ray Diffraction System	株式会社 SmartLab 9kW AMK	Advanced	23年度	
	2 I-201	高橋准教授	Prof. Watanabe	高速ラマンイメージング分光分析システム	Raman Imaging Spectrometer System	RENISHAW/inVia Raman Microscope	General	23年度	
	3 I-201	藤川准教授/久保田教/高垣准教授	Prof. Fujikawa Prof. Kubota Prof. Takagaki	電界放出形走査電子顕微鏡SEM	Scanning Electron Microscope, SEM	日本電子株式会社/JSM-7900F	Advanced	29年度	
	4 I-201	高垣准教授	Prof. Takagaki	冷却断面加工装置	Cross section machining apparatus	日本電子株式会社/IB-19520CCP	Advanced	29年度	
	5 I-403	西原准教授	Prof. Nishihara	膜抵抗測定システム	Film resistance measuring system	株東陽テクニカ/MTS740-C	Advanced	23年度	
	6 I-403	西原准教授	Prof. Nishihara	インピーダンスアナライザ	Impedance analyzer	Solartron Analytical/ModuLab XM ECS	Advanced	29年度	
	7 I-403	Harish助教	Dr. Harish	走査型プローブ顕微鏡	Scanning Probe Microscope	株式会社製作所/SPM-9700	General	25年度	
	8 I-403	谷口准教授	Prof. Taniguchi	示差走査熱量計(DSC)	DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY	NETZSCH / DSC204	Advanced	28年度	
	9 I-403	渡邊准教授	Prof. Watanabe	21/ガス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析装置	Mass Spectrometry system	ブルーカーナルエクス/microflex LT-KCN	Bruker/microflex LT-KCN	General	29年度
	10 I-404	西原准教授	Prof. Nishihara	3D測定レーザー顕微鏡	3D Measuring Laser Microscope	OLYMPUS/OLS4000-SAT	SHIMADZU/OLS4000-SAT	Advanced	23年度
	11 I-404	西原准教授	Prof. Nishihara	TG-DSC同時測定装置	Simultaneous Thermal Analysis Apparatus	独国内務省リサーチ/STA 449F3 Jupiter	NETZSCH/STA 449F3 Jupiter	General	22年度
	12 I-404	渡邊准教授/西原准教授	Prof. Watanabe / Prof. Nishihara	発生ガス分析システム	Quadrupole Mass Spectrometer Coupling	NETZSCH/STA-QMS/GC	NETZSCH/STA-QMS/GC	General	23年度
	13 I-404	高橋准教授	Dr. Watanabe	分光蛍光光度計	SPECTROFLUOROPHOTOMETER	株式会社製作所/RF-5300PC	SHIMADZU/RF-5300PC	General	23年度
	14 I-404	高橋准教授	Dr. Watanabe	紫外可視近赤外吸収分光光度計	UV-VIS-NIR SPECTROPHOTOMETER	株式会社製作所/UV-3600	SHIMADZU/UV-3600	General	23年度
	15 I-404	高橋准教授	Dr. Watanabe	赤外顕微鏡	AUTOMATIC INFRARED MACROSCOPE	株式会社製作所/AIM-8800	SHIMADZU/AIM-8800	General	23年度
	16 I-404	田中宏昌助教(鬼塚さん)	Prof. Sugimura Dr. (Tanaka)	赤外顕微鏡	FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROPHOTOMETER	株式会社製作所/IRPrestige-21	SHIMADZU/IRPrestige-21	General	23年度
	17 I-404	山内教授/小椋尾准教授	Prof. Fujikawa / Prof. Kojio	ArクラスターイオンビームXPS	Nicolet iN10 MX FT-IR Imaging Microscope	アルバックファイ/PHI5000VersaProbe II	ULVAC/PHI5000VersaProbe II	Advanced	25年度
18 II-102	[溶液]谷口准教授/渡邊准教授 [固体]山内教授	Prof. Taniguchi Prof. Watanabe Prof. Yamauchi	超伝導核磁気共鳴装置NMR	Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Spectroscopy System	BRUKER/AVANCE III 600	BRUKER/AVANCE III 600	Advanced	25年度	
Quasi I2CNER Shared Equipment	I-2階ラウンジ	藤川准教授	Prof. Fujikawa	全自動製氷機	automatic icemaker	ホシザキ/IM-25M	HOSHIZAKI/IM-25M	General	25年度
	I-4階ラウンジ	渡邊准教授	Prof. Watanabe	純水製造装置/2台	pure water system	ホシザキ/IM-25M	HOSHIZAKI/IM-25M	General	25年度
	I-201.404	渡邊准教授	Prof. Watanabe	純水製造装置/1台	pure water system	ミリポア/Direct-QUV	Millipore/Direct-QUV	General	25年度
	I-403	Harish助教	Prof. Harish	純水製造装置/1台	pure water system	アドバンテック東洋機/RFU424TA	ADVANTEC/RFU424TA	General	25年度
	1 II-404	高橋准教授	Prof. Watanabe	共通有機合成室	Common Organic laboratory	オリエンタル他	Oriental etc.	General	26年度
	2 I-201	ユン准教授	Prof. Yoon	円二色分散計/Chirasscan CD	Chirasscan CD Spectrometer	アプライドフォトフィジクス/Chirasscan CD	Applied Photophysics/Chirasscan CD	Advanced	28年度
	3 I-403	Harish助教	Dr. Harish	高性能比表面積・細孔分布測定装置	Surface Characterization Analyzer	マイクロメリテックス/3Flex	Micromeritics/3Flex	General	25年度
	4 I-403	主:山内助教 副:渡邊准教授	Prof. Watanabe (Dr. Yamauchi)	コールドスプレーイオン源搭載TOF-MSシステム	Cold-Spray Ionization TOF MS System	JEOL/JMS-T100LP	JEOL/JMS-T100LP	Advanced	25年度
	5 I-404	カベ助教	Dr. Edalati	高圧ガス吸着量測定装置	High Pressure Isothermal Gas Adsorption Apparatus	日本ベル機/BELSORP-HP-1-MS	BEL JAPAN, INC./BELSORP-HP-1-MS	Advanced	22年度
	6 I-404	高垣准教授 / Dr. Harrington	Prof. Takagaki	3元スパッタリング成膜装置	RF Plasma Sputtering Apparatus	株式会社/TS-DC・RF303	Pascal corporation/TS-DC・RF303	General	22年度
7 II-102	高垣准教授	Prof. Takagaki	卓上型放電プラズマ焼結機	Spark Plasma Sintering (SPS) Systems	富士電工機械/SPS-211LX	FUJI ELECTRONIC INDUSTRIAL CO.,LTD./SPS-211	Advanced	28年度	
8 II-102	猪石助教	Dr. Inoishi	ホール効果測定装置	Hall Effect Measurement System	ナトメクス社/HL5500PC	Nanometrics/Hall Effect Measurement System	Advanced	29年度	
9 I-101	高垣准教授	Prof. Takagaki	2次イオン質量分析装置SIMS	Secondary Ion Mass Spectrometry(TOF-SIMS)	ION-TOF社/PS02B11	ION-TOF/PS02B11	Advanced	25年度	
10 II-サーバルーム(203)	池田助教	Dr. Ikeda	基礎研究を目的としたハイパフォーマンスクラスター	High performance cluster for basic research	NEC	NEC	Advanced	28年度	
<p>その他の装置利用希望者は、「共通機器利用申請書」の提出は不要です。担当研究者より利用許可を得てください。 The person who would use the following equipment do NOT need to submit "Application for I2CNER Shared Equipment". Please get permission for use from the researcher in charge.</p>									
	Location	Resercher in charge	Equipment	Manufacturer/Type	Category	購入年度			
Others	1 I-201	高垣准教授	Prof. Takagaki	酸素・窒素・水素分析装置	O2, H2, N2 ANALYZER	株式会社製作所/EMGA-930-SKU	HORIBA/EMGA-930-SKU	General	23年度
	2 I-403	渡邊准教授	Prof. Watanabe	キャリア移動度測定装置	Carrier mobility measuring system	分光計器機/CMM-250TP	Bunkoukeiki Co.,Ltd./CMM-250TP	General	23年度
	3 I-403	Harish助教	Dr. Harish	磁気浮遊式吸着量測定装置	High Pressure Adsorption Measurement	日本ベル機/MSB-GS-100-10M	Bel JAPAN, INC./MSB-GS-100-10M	Advanced	25年度
	4 I-403	Harish助教	Dr. Harish	レーザー回折式粒子径分布測定装置	Laser diffraction Particle Size Analyzer	株式会社製作所/SALD-2300	SHIMADZU/SALD-2300	General	25年度
	5 I-403	田中宏昌助教	Dr. Tanaka	光電子顕微鏡システム	Photoemission Electron Microscope System	株式会社製作所/My PEEM AV318-A1	KAN MANUFACTORY CO.,LTD /My PEEM AV318-A1	Advanced	25年度
	6 I-403	高垣准教授	Prof. Ishihara	冷間静水等方圧プレス機	Cold Isostatic Press	エヌビーエーシステム機/CPA50-300	Npa SYSTEM/CPA50-300	Advanced	28年度
	7 I-404	西原准教授	Prof. Nishihara	一軸加圧電気炉	Uniaxial Pressing Electric Ingle	株式会社ヤマ/MHP16-7520	MOTOYAMA/MHP16-7520	Advanced	23年度
	8 II-102	Saha教授 (Harish助教)	Prof. Saha (Dr Harish)	表面エネルギー測定装置	Inverse Gas Chromatography	Surface Measurement Systems/IGC-SEA	Surface Measurement Systems/IGC-SEA	Advanced	28年度
	9 II-404	渡邊准教授	Prof. Watanabe	恒温型熱機械分析装置	ThermoMechanical Analysis	ネッチ・ジャパン(株)/TMA4000SE	NETZSCH Japan K.K./TMA4000SE	Advanced	28年度
	10 II-404	高垣准教授	Prof. Takagaki	遊星型ボールミル	Planetary Ball Mill	フリッツユ社/PL-7	FRITSCH/PL-7	Advanced	28年度
	11 II-サーバルーム(203)	池田助教	Dr. Ikeda	地震探査データ解析システム(計算サーバー)	High-Performance Computing Cluster for Seismic Data Processing	HP	HP	Advanced	25年度
	12 II-サーバルーム(203)	石原教授(アクベイト任教授)	Prof. Ishihara (Prof. Akbay)	原子論的シミュレーションを目的としたハイパフォーマンスクラスター	High performance cluster for atomistic simulation	NEC	NEC	Advanced	29年度
	13 II-101	高田教授 (生田さん)	Prof. Takata (Mr. Ikuta)	液中観察試料ホルダー	In-liquid specimen holder	日本電子機製/Poseidon Base PJAS-3031	JEOL/Poseidon Base PJAS-3031	Advanced	29年度
	14 II-102	田中宏昌助教	Dr. Tanaka	ナノインデンテーションシステム(UNHT)	Ultra Nanoindentation Tester	Anton Paar社/OPX-UNHT	Anton Paar/OPX-UNHT	Advanced	28年度
	15 II-104	ユン准教授(谷田部助教)	Prof. Yoon (Dr. Yatabe)	安定同位体比質量分析システム	Stable Isotope Mass Spectrometer	英国アイソプライム社/IsoPrime 100	Isoprime/IsoPrime 100	Advanced	25年度
	16 II-203	久保田教授	Prof. Kubota	ハルシエ型カルバニ電池式酸素分析計	Trace Oxygen Analyzer MX3/N	日本エアリキッド機	AIR LIQUIDE Japan Ltd.	Advanced	23年度
	17 HY30	(秋葉特任教授)	Prof. Akiba	炭素材料水素吸蔵特性評価装置	Apparatus for Measurement of Hydrogen Pressure-Composition Isotherms of Carbon Materials	日本重化学工業/J-232-P3-11-21	JMC/J-232-P3-11-21	Advanced	25年度

General: available for everyone.
Advanced: available for only authorized person.